

XF-E 04s 电场探头(30MHz~6GHz)



描述:

这种近场探头可以检测 IC 耦合产生的电场。探头的侧面采用屏障设计，所以侧面作用的电场不影响测量结果。这种近场探头的灵敏度允许在 0.5 到 10mm 的距离检测集成电路及其它电子模块的电场。这种近场探头小巧轻便，并采用外皮电流衰减。磁场探头采用电屏蔽设计。这种近场探头可以接到频谱分析仪或示波器的 50Ω 输入端。这些近场探头的内部安装有终端电阻。

具体指标:

频率范围	30 MHz ~ 6 GHz
探头尺寸	≈ (5 x 5) mm
输出接口	SMA
频率特性 [dBμV] / [dBμV/mm]	
电场校正曲线 [dBμV/mm] / [dBμV]	



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn